

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 1 月 27 日 (27.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/008698 A1

(51) 国際特許分類⁷: H01G 2/06, H01L 23/12,
H01G 4/228, H05K 1/18, H01G 4/30

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/010188

(22) 国際出願日: 2004 年 7 月 16 日 (16.07.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-199968 2003 年 7 月 22 日 (22.07.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 村田製作所 (MURATA MANUFACTURING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市天神 2 丁目 2 6 番 1 0 号 Kyoto (JP).

(NISHIZAWA, Yoshihiko) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市天神 2 丁目 2 6 番 1 0 号 株式会社 村田製作所内 Kyoto (JP).

(74) 代理人: 小原 肇 (OHARA, Hajime); 〒2220033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2 丁目 1 4 番地 1 4 新弘ビル 5 階 Kanagawa (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(72) 発明者; および

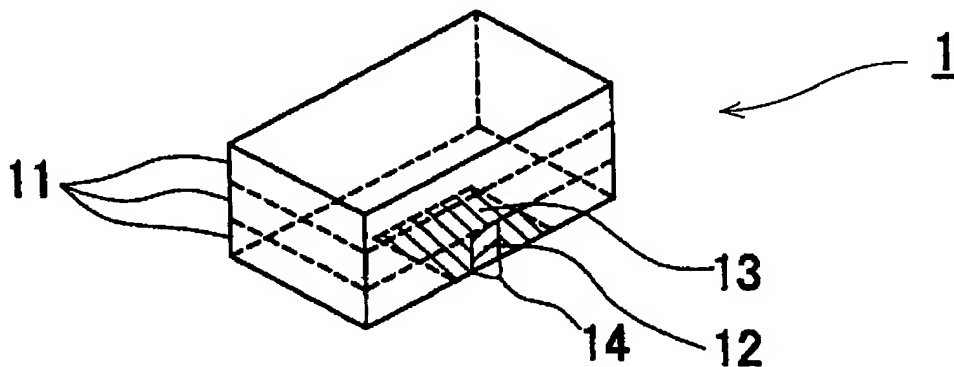
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西澤 吉彦

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[続葉有]

(54) Title: SURFACE MOUNTING TYPE PART

(54) 発明の名称: 表面実装型部品



(57) Abstract: [PROBLEMS] To solve a problem with an appearance inspection method for the surface mounting type part (31) of a type shown in Fig. 18 wherein the method cannot be easily introduced in an actual production site due to its high cost since a transmission device itself is expensive in an appearance inspection by fluoroscopy even if an appearance inspection method described in the patent document 2 can be used for the appearance inspection. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] This surface mounting type part is characterized by comprising a ceramic substrate having a first principal plane, a second principal plane, and side faces connecting these first and second principal planes to each other, a terminal electrode (13) installed on the first principal plane, and a first conductor (12) for appearance inspection extended from the terminal electrode (13) continuously to the side faces and formed in a width dimension smaller than the width dimension of the terminal electrode (13).

(57) 要約: 【課題】 図 18 に示すタイプの表面実装型部品 31 の外観検査を行う場合に、特許文献 2 に記載の外観検査方法を適用できたとしても、X 線透過による外観検査では透過装置自体が高価であるため、実際の製造現場ではコスト的に容易に導入できない。【解決手段】 第 1 の主面、第 2 の主面及びこれら第 1、第 2 の主面間をつなぐ側面を有するセラミック基板と、前記第 1 の主面に設けられた端子電極 13 と、この端子電極 13 から連続して側面に延設され且つ端子電極 13 の幅寸法より小さな幅寸法に形成された第 1 の外観検査用導体 12 と、を有することを特徴とする。

WO 2005/008698 A1



SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。